装置管理システムマニュアル Equipment System Manual

物質·材料研究機構

電子顕微鏡解析ステーション ナノ構造解析グループ

NIMS Electron Microscopy Analysis Station, Nanostructural Characterization Group



- ユーザー登録(内部利用) •••••••••2 User Registration (Internal)

- •利用料金について ·················18 The Support Charge



ユーザー登録/User Registration

[URL]

🖉 ユーザー登録

職員番号

NIMS staff I

必要事項をご記入の上、ご登録ください。 ※は必須入力項目になります。

https://www.nmcp.jp/

「NIMS内部ユーザーの登録はこちらから」をクリックします。 ユーザー登録済みの方はメールアドレス(大文字・小文字を区別します) とパスワードでログイン。

Please click "NIMS User Registration".

NIMS微細構造解析共用装置管理システムをご利用いただくためのユーザー登録フォームです。

SECURED

by jPRS

If you are a registered user, log in with your email address (case sensitive) and password.

・役職

Job Position

)所国機関郵便番号

Office Zip Code

このサイトは、ブラウザとサーバー間での情報の送受信が暗号化る

れています。左記の画像をクリックして証明書の内容をご確認くだ



各項目に情報を入力して、「本システムのプライバシー保護に関 する取り決めについて」を確認後「同意する」にチェックを付けます。 次へ→登録

Please agree after reading "The Rule of Privacy Protection of This System" regarding the handling of personal information \checkmark agree with the handling of the privacy information.

半角英数字3~16文字 ◎パスワード Password [例] 茨城県つくば市千現1-2-: ◎所属機関住所 [例] 于現太郎 ([Ex] 1-2-1 Sengen, Tsukuba, ○氏名 Office Address (TEx1 Taro SENG Name [#] 029-859-2310 ● 重託番号 【例】 センゲン タロナ (TEx1 029-859-2310 ◎氏名 (カナ) (IEx) センゲン タロワ Name (Englis パソコンでメール受信できるアドレス 20代以下 (under 20's) ■Eメールアドレス (E-mail address of your personal com ◎年齢層 30/£ (30%) E-mail Address 経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者 ● 40/€ (40%) ■特定類型の該非 (Person substantially under the control of foreign government by econor 50代以上 (50's and more) Judgment of Specif interests) すでに日本に6ヶ月以上滞在している 🔍 (thu (Yes ■居住者非居住者の別 大企業 (Large enterprise) (従業員100人以上) (Have you already been staying in Japan over 6 months?) いいえ (No) 中小企業 (Small and midium-sized enterp) はい (Yes) 企業(その他) (Company enterp ●いいえ (No) 上記の他、国内において外国政府等の指示の下で行動する者 ◎ユーザー区分 ● 大学篇 (University) (Person acting in Japan under instructions of a foreign g ※NIMSジュニア研究員はNIMSを選択してください 現在の所属機関に現在雇用されている (ູ່ (Yes) ◎雇用関係の右無 %For NIMS Junior Researcher, please select "NIMS" ● いいえ (No) (Are you currently employed by the present affiliated institution?) ● 公的研究機関 (Public instituti はい (Yes) NIMS (NIMS) 送信いただく個人情報について「本システムのプライバシー保護に関する取り決めについ いいえ (No て」をご覧いただき同意してください。 個人情報の取扱い [#] 00** 00#+** (Please agree after reading "The Rule of Privacy Protection of This System Handling of personal 所属機関 契約に基づき、外国政府・大学等の支配下にある者 regarding the handling of personal information. (Person under the control of a foreign government, corporation or university by 以上の内容に同意する(agree with the handling of the privacy information) contract) はい (Yes) [例] 工学部〇〇学科,大学院〇〇研究科〇〇専攻,〇〇事業 「回部事 ●いいえ (No (IEx1XX Department, XX Divis 次へ(Next)

[例] 学部生,修士1年,ポスドク,教授,研究員

[#1] 305-004

([Ex] 305-0047

ユーザー登録が完了すると、 本登録のお知らせメールが届きます。 After user registration, You will get a mail of completion.



【URL】 <u>https://www.nmcp.jp/</u> メールアドレスと登録したPasswordでログインしてください。 Please login with your user email address and password.



ユーザー本登録のお知らせ/Notification of user registration

ユーザー本登録のお知らせ

NIMS 共用装置管理システムよりお知らせいたします。

ユーザー登録の手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

ユーザーID: *****

ご登録いただいたメールアドレスとパスワードを使用してログインし、「新規利用申請」へ進んでください。

*パスワードはログイン後,ご自身で変更可能です。

NIMS 共用装置管理システムログインページ:<u>https://www.nmcp.jp/</u> 装置管理システムの手順(マニュアル):https://www.nims.go.jp/nmcp/content/files/shinseitejun.pdf

This is a message from NIMS microstructural characterization facility services system. Your user registration has been completed.

User ID: *****

When you receive this registration notice, please log in with your email address and password, you can access "New Application".

You can change the password by yourself after you logged in.

[Registration System URL] https://www.nmcp.jp/

Please refer to the link (the manual). https://www.nims.go.jp/nmcp/eng/content/files/shinseitejun_eng.pdf

【ご注意】 本メールは送信専用となります。このメールへの返信はご遠慮ください。 お問合せは下記までお願いいたします。

[Notice] Please do not reply to this e-mail. If you have any inquiries, please contact us below.

利用申請(内部利用)/Application for use

利用申請・支援履歴より新規利用申請を行ってください。

Please apply from "Application for use/Support history" page.



※利用料金は税抜き表示(not including consumption tax)

				2022年度/2022	2FY				
ユード	課題ID Application ID	分野 Station	区分 Type	申請日 Application date	状態	データ共有	利用料金 Usage fee	最終利用日 The date of last use	修正 Revised
Code		支援課題名 A title of application		申請者 Applicant	Status	Data Share	公開/非公開	支援日 The date of support	削除 Deleted

NIMS 微細構造解析装置 管理システム	l		National Institute for Materials
ユーザ さん ^ ■ マイページ My Page	◎利用申請・支援履歴 - 規約の承認 Application	for use / Support history (Acceptance of the Terms)	
 利用申請・支援届歴 Application for use / Support history 装活予約 	利用規約 General Conditions for Use of Equipment and Facilities	各装置の利用ルールを順守してください。 Please obey the usage rule of each equipment.	
Equipment reservation 課題別利用料金 Support charge by each subject	注意事項 Notice	年度ごとに利用報告書の提出が義務付けられています。 It is required to submit the usage reports annually.	
■ ログアウト Output Registration	規約の承認 Acceptance of The Terms	□利用規約を承認します。また、報告書の提出に同意します。 I approve the terms and agree to submit the report.	
	研究不正防止等に係る宣誓 Promise never to do research misconduct	□NIMSの定める規則、事項を遵守します。 I obey NIMS regulations and terms. □研究活動における特定不正行為(捏進、改ざん及び盗用)、及びそれ以外の不正行為(不適切なオーサーシップ、二重投稿等)を行いません。 I will not do any research misconduct (fabrication, falsification, plagiarism, unapt authorship, and duplicate submission).	

利用規約に同意し、利用を申し込む / I agree with above provisions, and would like to apply.

利用規約・注意事項の確認と承認をして、「利用規約に同意し、利用を申し込む」をクリック

After confirming the contents and approving, please click "I agree with above provisions, and would like to apply.".

利用実績に基づく月毎(1ヶ月毎)の請求

Deferrend Payment(Pay every month)

※内部課金の支払いルールに基づき、振替申請によりお支払いいただきます。

※Please pay by transfer application (振替申請) based on the payment regulations of the internal charge(内部課金).

支払い方法に同意する / I agree with above.

メッセージを読んで「支払方法に同意する」をクリック Please read the message and click "I agree with above.".

申請年度 Application FY	2022年度 🗸	(自請年度を確認してください。	
申請者 Applicant	User	Please confirm application year, FY20**.	

は必須項目 (means "required fields")

	研究支	援概要 Overview of Research Support	
*分野 Field	指定なし ▼	【機器利用·技術補助 Common use/	'Technical Support
*支援課題名 Title of Research-Support Subject	現在の文字数[Current number of characters] 0 ※ 40字以内で記述してください。 * Please input 40 characters or less.	分野(TEM千現)を選ぶと装置名が表示されま Please choose TEM-Sengen and equipment you 【技術代行 Technical Surrogate】	す。利用する装置をすべて選択します。
*研究概要 Overview of Your Research	現在の文字数[Current number of characters] 0 250文字以内でお願いします。 Please input 250 characters or less.	分野(TEM千現) をお選びください。装置名の通 Please choose TEM-Sengen. There are no need	選択は不要です。 to select any equipmenta.
*データ共有 Data share *NIMS ワークフローシステム課題番号 Applicant ID which was obtained from the NIMS Workflow System	○共有あり(Yes) ○共有なし(No) 22NM****	NIMSワークフローシステムで取得した <mark>課題番号</mark> をプ Please fill in your Application ID from the NIMS Work	、 人力してください。 〈flow System.
備考 Note			
*希望支援形態 Support Style	機器利用(Common use) ✓ 支援依頼内容[Content of support request]: ※技術代行の方は記入してください * For Technical surrogate users	7	* means "required fields"



入力内容を確認する(Confirm)

修正する(Back)

記入が完了したら、「入力内容を確認する(Confirm)」をクリックします。 After completing the entry, click "Confirm".

その後、「上記内容で申請する(Submit)」をクリックします。 And then click "Submit". 申請を受け付けました。 Application has been accepted.

新規利用申請受付のお知らセメールを送信しました。 "Registration of use application" mail has been sent.

Back to My Page

申請を受け付けしました。 The application has been accepted.

装置の予約/Equipment Reservation

NIMS 微細構造解析装 Experience Factor Refer	置			∍	ィセ	シス	所持	持者の	りみこ	「自」	身で ⁱ	機 器	利用	lの予	·約t	が可自	能でで	す。									Na	ationa	Instit	ūte foi	• Mater	rials Science
ユーザ temuser さん				- ι	Jsers	hav	e a li	icens	e car	า ma	ike a	rese	rvat	on oi	n vo	ur ov	vn.															
■ マイページ My Page	■ 装置予約 Equipment reservation																															
理题由话,支择履网																																
Subject application / Support instory	前月へ Previous month										20	018年	03月	March, 20	018												次	月へて	Next mor	nth		
· 装置予約 · Equipment reservation	予約したい装置もしくは日にちをクリックして	下さい (Click t	he ma	achin	e nan	ie or	the d	ate yo	ou wai	nt to	book.)											★ ↓の	予約(Your	ooking		・仲	トの予	約 (Ot	hers)
Support charge by each subject		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ロ グアウト	装置名	*	~ *	+	- H	8	4	, zk	*	\$	+	8	8	14		*	*	+	B	8	14	zk –	*	*	+	8	8	14	20 7k	*	*	+
Output Registration			-	-	_		~			-	-			~				-														-
	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡			7 3	7 4		· • +	1-				•	• •																			
	(JEM-ARM200F-B) 300以生要放中取法法生子類治療				ヤぞ	「」	汰	/Re	sei	rva	tioi	nΝ	/let	hoc				_														
	(Tecnai G2 F30)	_		•	1 11			/																								
	300kV電界放出形電子顕微鏡	(1)	+1*	жı	_	ヱ	幺与I	+.	-1 \	壮	署々	ו ל	┍┛┟	+ヽオ	2																	
	(JEM-3000F) 2000以作用放出彩漆源于之前治济	(U)Io																														
	(JEM-2100F1)																															
	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)		フリ・	ック	ル	ます	_																									
	200kV透過電子顕微鏡	•	•		-		Ŭ																									
	(JEM-2100)		irct	. nl	0-2		lic	4 2	$n \circ d$	i	nm	n	+/4	പ്പ	۱			_														
	(JSM-7000F)	Г	11 20	, pi	Eq:	se (JIIC	ĸа	11 8	yuı	μu	IEII	ι(u	ale).																	
	FIB加工装置			•						•	•		•		•																	
	(JIB-4000)																															
	FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																															
	装置名	1	2	3	4	5	6	7 7k	8	9	10 +	11	12	13	14 7k	15 ★	16	17 +	18	19 日	20	21 7k	22	23	24	25	26	27	28 7k	29 ★	30 金	31 +
	FIB加工装置			-	-		~				-	_		~				-	-		~				-	-		~				
	(JEM-9310FIB1)																															
	FIB加工装置																															
	(JEM-9310F1B2) ビックアップシステム	-																														
	(Pick-up System)																															
	デュアルビーム加工観察装置																															
	(NB5000)																															
	TEM試料作製装置群																															
	(「こうしんや「Factoriation」)	-																														
	(Ultramicrotome)																															
	HRTEM解析システム																															
	(HRTEM解析システム) 売フ領ト エグニコン 約45×コニノ	_																						l								
	电丁孫 ドモノフノイ 一解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																															
~	冷陸極電界放出形ローレンツ電子顕微鏡																															* PAGE TOP

※グレーの箇所は他の予約があります。

Gray areas have other reservations.



-+f temuser さん

■ マイページ My Page

									2	00kV電界	放出形透	過電子顕微	鏡 (JE	M-2100	2)								
		1	前月へ Prev	vious month							2018年	03月 Marc	ch, 2018						次月へ	Next month			
日付をク	リックし	て予約をしてく	ください。	(Click a da	ate and	make a	reserv	vation.)										:本人の)予約 (Yo	our bookin	g) 🔳	他人の予	約 (Othe
		09		10		11		12		13		14		15		16	17		18		19		20
1	*																						
2	金																						
3	±					<i>b1</i> 1	1	/	عدر ر			<i>L</i> 1		I									
4	B		(2)次に	৾৾৵৾	新して	エーし	い日付	†(装	(古)	・クリ	ックし	Σ.	व									
5	月				, , ,		/ _ •	- · ·	1 1 2 2			// 0		/ 0									
6	火			Novt	nla	าวก	cli		date	1 n	uuinu	nont	۲١										
7	水			INEXL	, pic	case		LN a	uate	こしらい	լար		LJ.										
8	木		1		1	1	1																
9	金																						
10	±																						
		09		10		11		12		13		14		15		16	17		18		19		20
11	B																						
12	月																						
13	火																						
14	水																						
15	*																 						
16	金																						
1/	-																						
18	-																						
19	<u>н</u>																						
20	~	09		10		11		12		13		14		15		16	17		18		19		20
21	7k																						
22	*																						
23	金																						
24	±																						
25	8																						
26	月																						
27	4																						

※グレーになっている箇所は一部でも重複があると予約できません 黄色のラインは本日を意味します。

Gray cell has already been reserved. You can not make a reservation at the same time. Yellow line shows today.

NIMS 微細構造解析装 管理システム	置				National Institute for Materials Scien
ユーザ temuser さん ^ ■ マイページ My Page	❷ 装置予約 - 新規登録 Equipment reservation	n (New Registration)			
■ 課題申請・支援履歴 ・ 装置予約 Equipment reservation	予約日 Day	2018-03-14	Choose AM or PM		
Support charge by each subject	開始時間~終了時間 Start ~ End				
■ ログアウト Output Registration	装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡(:	EM-2100F2)		
	予約者 Subscriber	temuser	④課題を選択し	します。	
	利用者 User	temuser	Choose a sul	bject	
	課現 <u>日</u> Subject	課題を選択してください			
	利用形態 Use Style	機器利用			
	コメント Comments	E	入力が完了したらこちらる Click here	をクリック	
	入力内容を確	認する/Confirm		J.	हа∕Back
【補足事項/Supple * AM&PMで利用し If you'd like to rese	emental remarks】 たい場合、両方にチェックを入れ erve both AM and PM, you need t	、てください。 to check both.		TEM試料们 About TEM • 1時間単位	作製装置群について sample preparation apparatus 立での予約になります。
* TEM試料作製装置 TEM sample prepa	置群については、利用開始時間と ration apparatus require choosing	:終了時間を選択し ⁻ g the start time and	てください end time instead of AM/PM.	Reservati • 装置予約 Reservab • 試料作製 Room ava	ions can be made in 1 hour increments 」は9:00-16:00までです。 le hours: 9am to 4pm. 皇室のご利用は9:00-16:30までになります。 ailable hours: 9am to 4:30pm.
* 装直の 予約は 削り	コまでに行ってくたさい。 当日にう	P約はでさません。		 装置管理 	システムで入力した時間は、利用料金に

Please make a booking for the facilities by the day before. You can not make a booking on the day.

* 必要に応じてコメント欄を活用ください。 Please use Comments if necessary.

12

そのまま反映されるため、昼休みや休憩時間を含

Reserved time slots will be fully charged, so be

sure to exclude lunch breaks or recesses when

む利用は予約を分けてください。

you make a reservation.

NIMS 微細構造解析装置 管理システム

ユーザ temuser さん ■ マイページ My Page

接置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

采约口

Cubick confiction / Concert history	
• 装置予約 Equipment reservation	

 試えのパイリナルや土 Support charge by each subject
 ログアウト Output Registration

NIMS

■ マイページ My Page

レーザ temuser さん

装置予約 Equipment reservation

Subject application / Support history

Support charge by each subject

■ 課題申請・支援履歴

■ 課題別利用料金

■ ログアウト Output Registration

Day	2018-03-14
開始時間~終了時間 Start ~ End	09:00 ~ 12:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F2)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課現 Subject	[ID-TEM-test1] 例) * * * * * * * * の観察
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

内容を確認後、 予約を確定します。 After confirmation, finalize your reservation.

NIMS微細構造解析装置

管理システム

利用予定日の前日からキャンセルできませんので,ご注意下さい。

Please note that you will be not able to cancel the reservation from the day before the scheduled date of use.

National Institute for Materials Science

戻る/Back

接置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

登録しました/Completed

トップへ戻る/Back to Top Page

予約の修正・取消/Revision & Cancellation

NIMS 微細構造解 管理システム	新装置																								Nation	al Inst	itúte fo	or Mate	rials
ユーザ temuser さん																													
■ マイページ My Page	◎ 装置予約 Equipment reservation	n																											
调明中誌,安塔房麻																													
	前月へ Previous month									20	18年 0-	4月 Apri	il, 2018												次月へ	Next m	onth		
· 装置予約 Equipment reservation	予約したい装置もしくは日にちをクリックし	て下さい	(Click	the m	achine	name o	r the o	date yo	ou war	nt to b	00k.)																		
Support charge by each subject																					:本人	の予約	(Your	bookir	ng)	- : 代	国人の予	<u> </u>	the
	装票名	1	2	3	4	5 6	5 7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	16 1	7 1	3 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Output Registration		E	月	火	水	木 🖆	È ±	: 8	月	火	水	木	金	±		月 🎐	< 기	< 木	金	±	E	月	火	水	*	金	±	E	月
	実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200E-C)																						1			1 1		1 1	
	(JEM-ARM200F-G) 実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡																		_						\vdash	<u> </u>	\vdash		_
	(JEM-ARM200F-B)																												
	300kV電界放出形透過電子顕微鏡																									1 1			
	(Tecnai G2 F30) 300kV(市界放出形示子照微鏡								-						_		_	_	_						┝──┤	<u>⊢</u> /	$ \longrightarrow $	'	_
	(JEM-3000F)																						1	1 1		1 1		1 1	
	200kV電界放出形透過電子顕微鏡																												
	(JEM-2100F1)																						4	4					
	200kV電界放出形透過電子顕微鏡																						1 1	1 1				1 1	
	(JEM-2100F2) 200k//洗澡電子類微鏡											_			-		_	-			_	-	+		┝──┤		\vdash	<u> </u>	_
	(JEM-2100)																						1 1	1 1		1 1		1 1	
	走宣電子顕微鏡 (JSM-7000F)																												
	FIB加工装置																												
	(JIB-4000)			_											_								4		──┤	\vdash	$ \longrightarrow $	('	
	(JEM-9320FIB)																							4/					
	装覆名	1	2	3	4	5 6	5 7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	16 1	7 1	8 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		B	月	火	水	木 🔮	ž ±	: 8	月	火	水	*	金	±		月ッ	く オ	< 木	金	±	E	月	火	水	木	金	±	E	月
	FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																												
	FIB加工装置																												
	(JEM-9310FIB2)																	_	_							\vdash	$ \longrightarrow $	<u> </u>	
	(Pick-up System)																							1 1		1 1		1 1	
	デュアルビーム加工観察装置																						+			<u> </u>	\vdash		_
	(NB5000)																									1		()	
	ウルトラミクロトーム																												
	(Ultramicrotome)														_			_	_				+	+	—	—	$ \longrightarrow $		
	(HRTEM解析システム)																									1 1			
	電子線トモグラフィー解析システム																												
	(電子線トモグラフィー解析システム)																		_					4!	\mid	└── ′			
	イオンスライサー Ion Slicer																									1 1			
			-						-										_		_	-	+	+	+	+ <i>'</i>	\vdash		T F

①修正・取り消したい装置をクリックします。

Click an equipment which you would like to revise or cancel.





■ PAGE TOP

1-ザ temuser さん

■ マイページ My Page



■ 課題別利用料金 Support charge by each subject _ ログアウト Output Registration

◎ 装置予約 - 詳細 Equipment reservation (Details)

予約日 Day	2018-05-16
開始時間~終了時間 Start~End	13:00 ~ 16:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[] test課題
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

利用予定日の前日からキャンセルできませんので、ご注意下さい。

Please note that you will be not able to cancel the reservation from the day before the scheduled date of use.



戻る/Back

https://www.nmcp.jp/main.php

③内容に間違いがないかを確認し、クリック。

Confirm all the contents and click "Revise" or "Cancel".





この画面になれば作業は完了です。

This page means "Completed".

注:予約者本人によるキャンセル・変更は予約日の2日前まで可能です。

予約日前日からのキャンセル・変更はナノ構造解析グループ事務局(tem@nims.go.jp)にご連絡をお願いいたします。

使用開始時間の24時間前までのキャンセルは課金されませんが、それ以降のキャンセルは課金される場合がありますのでご了承下さい。

Note: Users can cancel or reschedule their reservation up to 2 days before the reservation date.

From the day before the reservation, please contact Nanostructural Characterization Group office(tem@nims.go.jp) for your cancel. The cancellation must be made at least 24 hours prior to the reservation, otherwise a cancellation fee may be charged.

利用料金について The Support Charge

NIMS 微細構造解析装 管理システム	置												National	Institute for Materials \$
ユーザ ^ ■ マイページ My Page	🛯 課題別利用料	金 Support cha	arge by each sub	ject										
■ 利用申請・支援履歴 Application for use / Support history 装置予約							2022年度 🗸 表	示する/Show						
震語別利用料金						2022年度 課題	詞利用料金一覧 [2	022-06-15 現在]	Total Usage Fees					
	א−⊏	課題 Applica	ID 🔺 ition ID				支援課題名 A title of subject					申請者 Applicant		データ共有
Output Registration	Code	4月 April	5月 _{May}	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	1月 January	2月 February	3月 March	合計 Total
				テスト										なし
	1817	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0
				テスト										なし
	1905	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥0 印刷 Print	¥O 印刷 Print	¥0 印刷 Print	EPR	¥0 印刷 Print	¥0

内部利用とAIRM利用は、このページで月ごとおよび 年度合計の利用料金を見ることが出来ます。 「印刷」をクリックすると利用明細書が表示されます。 (NOF利用は除く)

You can see the support charge on this page. If you click the print button, the usage details will be displayed.

(Excluding NOF use)

2017年度3月 電子顕微鏡ステーション 利用明細書

	邇	DTHed							
	講 師	§							
	痲	N.N.		棚小					
	鱡	題載	新 翻)−1						
	輸納	輸動		輕短級)-1,					
	[第12-4	() 1200		Bandi Bandin					
	御顧	000000	Amalah Amalah						
427	8/78	225-10	535		276		1214	741	
652	RORUHE	6688 IS	tHSE		6538		696	1//1	
1884	BINE	I II II ELLINE			翻		tin		
		3,500円							

a ESA CREEKA SULEE AREA (SER COLOT). AREA SULEE OF AN AREA (SER COLOT). Davier annot takin University on Sagnat Major onk Trouge for ange for the seried final, complete the local to signal spatial.